

医薬品開発ツールとしての母集団 PK-PD 解析 第 2 刷正誤表

[2012 年 9 月 6 日作成]

目次 vi ページ

参考文献の下を以下のように修正.

演習用データ 193

補 遺 194

索 引 196

24 ページ 本文 7~9 行目

誤 ICON 社の NONMEM サイト (<http://www.icondevsolutions.com/nonmem.htm>) に, NONMEM の特徴や入手連絡先が記載されているので, 参照されたい.

正 ICON 社の NONMEM サイト (<http://www.iconplc.com/technology/products/nonmem/>) に, NONMEM の特徴や入手連絡先が記載されているので, 参照されたい. **詳細は巻末の補遺を参照のこと.**

43 ページ 表 2.4

誤 2 KA, K, V

正 2 KA, **CL**, V

47 ページ 本文 14 行目 (1 文字削除)

誤 ③3 データ構造に問題がある場合

正 ③データ構造に問題がある場合

93 ページ 本文 4~7 行目

誤 (下線部)

推移を, 連続計算により算出するときの刻み幅を定義する. 数字が大きければ刻み幅が小さくなり, より正確な連続計算を行う. 通常用いられている倍精度版のNONMEMでは \$ESTIMATION (\$EST) の SIGDIGIT オプションで定義する有効桁数 (デフォルトは 3) に 2 または 3 を加えた数字を TOL に設定することが推奨されている⁹⁾.

正 (太字)

推移を, 連続計算により算出するときの刻み幅を**制限するための許容誤差を定義する. NONMEM 7 では \$EST (ESTIMATION) の SIGL オプションで刻み幅を定義する. \$EST の SIGDIGITS オプションで定義する有効桁数 (デフォルトは 3) の 3 倍以上の値を SIGL に設定し, SIGL の設定値以上の値を TOL に設定することが推奨されている⁹⁾. [本書では演習効率の観点から TOL=5 を用いている.]**

100 ページ コード 6 行目

誤 $KE = CL/V$

正 $KE\textcolor{red}{L} = CL/V$

101 ページ 図 3. 10, 点線内の一番右上

誤 KE

正 $KE\textcolor{red}{L}$

114 ページ 設問 5, 罫線で囲んだコード, 上の点線内

誤

$EMAX = THETA(4)*EXP(ETA(4))$

$EC50 = THETA(5)*EXP(ETA(5))$

$SF = THETA(6)*EXP(ETA(6))$

$E0 = RBL$

正

$EMAX = THETA(\textcolor{red}{1})*EXP(ETA(\textcolor{red}{1}))$

$EC50 = THETA(\textcolor{red}{2})$

$\textcolor{red}{E0} = \textcolor{red}{RBL}$

$\textcolor{red}{SF} = \textcolor{red}{THETA(3)}$

116 ページ 4 行目, 式の分子の最後

誤 $-C_{Rmax}^{\gamma} \cdot k_{in}$

正 $\textcolor{red}{+}C_{Rmax}^{\gamma} \cdot k_{in}$

116 ページ 5 行目, 式の分子の最後

誤 $-C_{Rmax}^{\gamma} \cdot k_{out} \cdot R_0$

正 $\textcolor{red}{+}C_{Rmax}^{\gamma} \cdot k_{out} \cdot R_0$

121 ページ 6 行目

誤 9) Boeckmann, A. J., Beal, S. L., Sheiner, L. B. : NONMEM User Guide – Part IV NM-TRANS Guide. 1992.

正 9) $\textcolor{red}{Bauer, R. J. : NONMEM User Guide – Introduction to NONMEM 7.2.0, 2011.}$

巻末の増補ページ

193～195 ページの索引を 196～198 ページに移動し, 新たに

193 ページに「演習用データ」を増補 (別ファイル参照),

194, 195 ページに「補遺」2 ページを増補 (別ファイル参照) した.